อัตราจัดเก็บค่าบริการอบรม ทดสอบ และวิเคราะห์ ด้วยเครื่อง X-ray Diffractometer รุ่น Bruker D8Discover พร้อมกับ Eulerian Cradle

รายการ	อัตราจัดเก็บ		
	ก *	ข *	ค *
บริการทดสอบ			
งานทดสอบด้วยวิธี Locked-coupled (θ - 2θ) scan ในช่วงการวัด 20° ถึง 100° ด้วยระยะ 0.02°/step และ 0.4 sec/step (หรือในช่วงระยะการวัดที่ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที)	850 บาท/ชิ้นงาน	1,250 บาท/ชิ้นงาน	2,000 บาท/ชิ้นงาน
งานทดสอบด้วยวิธี Locked-coupled (θ - 2θ) scan (สำหรับชิ้นงานที่มีช่วงระยะเวลาการทดสอบเกิน 30 นาที)	850 บาท/ครึ่งชั่วโมง **	1,250 บาท/ครึ่งชั่วโมง **	2,000 บาท/ครึ่งชั่วโมง **
งานทดสอบพิเศษด้วยวิธี Z scan สำหรับชิ้นงานฟิล์มบาง ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที	400 บาท/ชิ้นงาน	600 บาท/ชิ้นงาน	1,000 บาท/ชิ้นงาน
เทคนิค Grazing incidence diffraction (GID)	850 บาท/ครึ่งชั่วโมง **	1,875 บาท/ครึ่งชั่วโมง **	4,000 บาท/ครึ่งชั่วโมง **
งานทดสอบด้วยเทคนิคพิเศษอื่น ๆ เช่น เทคนิค Stress analysis, เทคนิค Texture analysis, เทคนิค Reflectometry (XRR), test with 2D detector	1,020 บาท/ครึ่งชั่วโมง **	1,875 บาท/ครึ่งชั่วโมง **	4,000 บาท/ครึ่งชั่วโมง **

หมายเหตุ

1. * ดูคำอธิบาย หน้าที่ 5 คำอธิบายอัตราจัดเก็บ
2. ** เศษนาที ปัดเป็นครึ่งชั่วโมง
3. กรอกข้อมูลการขอใช้บริการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-ray Diffraction ในระบบ Central Instrument Management System (CIMS) (เว็บไซต์ https://cims.kmutt.ac.th) ด้วยหน่วยงานผู้ดูแลมีนโยบายพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันจะเกิดจากข้อมูลที่เป็นความลับในงานวิจัยของผู้วิจัย หน่วยงานผู้ดูแลจึงจะไม่วิเคราะห์ผลการทดสอบให้หากไม่ระบุให้วิเคราะห์ผลในแบบขอรับบริการทดสอบและวิเคราะห์นี้
4. หน่วยงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อปฏิบัติต่าง ๆ

อัตราจัดเก็บค่าบริการอบรม ทดสอบ และวิเคราะห์ ด้วยเครื่อง X-ray Diffractometer
รุ่น Bruker D8Discover พร้อมกับ Eulerian Cradle

รายการ	อัตราจัดเก็บ		
	ก *	ข *	ค *
งานวิเคราะห์			
งานวิเคราะห์โครงสร้างและส่วนประกอบจากการทดสอบด้วยวิธี Locked-coupled (θ - 2θ) scan และค้นหาจากฐานข้อมูลมาตรฐาน JCPDS	400 บาท/ชิ้นงาน/ครึ่งชั่วโมง**	600 บาท/ชิ้นงาน/ครึ่งชั่วโมง**	1,000 บาท/ชิ้นงาน/ครึ่งชั่วโมง**
งานวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับเทคนิคพิเศษอื่น ๆ เช่น เทคนิค Stress analysis, เทคนิค Texture analysis, เทคนิค Grazing incidence diffraction (GID), เทคนิค Reflectometry (XRR), test with 2D detector	1,000 บาท/ชิ้นงาน/ครึ่งชั่วโมง**	1,500 บาท/ชิ้นงาน/ครึ่งชั่วโมง**	2,500 บาท/ชิ้นงาน/ครึ่งชั่วโมง**

หมายเหตุ

1. * ดูคำอธิบาย หน้าที่ 5 คำอธิบายอัตราจัดเก็บ
2. ** เศษนาที ปัดเป็นครึ่งชั่วโมง
3. กรอกข้อมูลการขอใช้บริการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-ray Diffraction ในระบบ Central Instrument Management System (CIMS) (เว็บไซด์ https://cims.kmutt.ac.th) ด้วยหน่วยงานผู้ดูแลมีนโยบายพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันจะเกิดจากข้อมูลที่เป็นความลับในงานวิจัยของผู้วิจัย หน่วยงานผู้ดูแลจึงจะไม่วิเคราะห์ผลการทดสอบให้หากไม่ระบุให้วิเคราะห์ผลในแบบขอรับบริการทดสอบและวิเคราะห์นี้
4. หน่วยงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อปฏิบัติต่าง ๆ

อัตราจัดเก็บค่าบริการอบรม ทดสอบ และวิเคราะห์ ด้วยเครื่อง X-ray Diffractometer
รุ่น Bruker D8Discover **พร้อมกับ** Eulerian Cradle

รายการ	อัตราจัดเก็บ		
	ก *	ข *	ค *
บริการอื่น ๆ			
เตรียมชิ้นงาน	400 – 3,000 บาท/ ชิ้นงาน (ขึ้นกับชิ้นงาน)		
รับผลทดสอบ/วิเคราะห์เพิ่มเติม	100 บาท/ แผ่น		
รับรองผลทดสอบพร้อมลงนามรับรอง	1,500 บาท/ ชิ้นงาน		
รับรองผลวิเคราะห์พร้อมลงนามรับรอง	1,500 บาท/ ชิ้นงาน		
รับรองผลทดสอบและวิเคราะห์พร้อมลงนาม	2,500 บาท/ ชิ้นงาน		

หมายเหตุ

1. * ดูคำอธิบาย หน้าที่ 5 คำอธิบายอัตราจัดเก็บ
2. การรับรองผลทดสอบหรือวิเคราะห์เป็นไปเพื่อการยืนยันผลจากการทดสอบหรือวิเคราะห์ชิ้นงานนั้น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้การวิเคราะห์จะเป็นไปตามข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจากเจ้าของหรือผู้ส่งชิ้นงาน
3. หากประสงค์จะนำผลทดสอบหรือวิเคราะห์ไปใช้เพื่อการโฆษณาหรือเผยแพร่ในเชิงการค้า บริษัทหรือผู้เผยแพร่จะต้องได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. หน่วยงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอและข้อปฏิบัติต่าง ๆ

อัตราจัดเก็บค่าบริการอบรม ทดสอบ และวิเคราะห์ ด้วยเครื่อง X-ray Diffractometer

รุ่น Bruker D8Discover **พร้อมกับ** Eulerian Cradle

รายการ	อัตราจัดเก็บ		
	ก *	ข *	ค *
ค่าบริการเร่งด่วน			
รับผลทดสอบ/วิเคราะห์ภายใน 1-3 วันทำการ	+ 200%		
รับผลทดสอบ/วิเคราะห์ภายใน 4-7 วันทำการ	+ 100%		

หมายเหตุ

1. * ดูคำอธิบาย หน้าที่ 5 คำอธิบายอัตราจัดเก็บ
2. จะคิดค่าบริการเร่งด่วนเมื่อมีชิ้นงานทดสอบจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. หน่วยงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอและข้อปฏิบัติต่าง ๆ

อัตราจัดเก็บค่าบริการอบรม ทดสอบ และวิเคราะห์ ด้วยเครื่อง X-ray Diffractometer
รุ่น Bruker D8Discover พร้อมกับ Eulerian Cradle

คำอธิบายอัตราจัดเก็บ

ก. หน่วยงานภายใน มจธ.
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน หรือภายนอกที่ นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรของ มจธ. เสนอผ่าน มจธ.

ข. หน่วยงานราชการนอก มจธ.
(ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด)

ค. หน่วยงานเอกชนทั่วไป

หมายเหตุ

1. นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ หรือ บุคลากรของ มจธ. ที่ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมสามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ผลได้ด้วยตัวเองโดยผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้ดูแลในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัยฯ ในการวิเคราะห์ผลจากเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ ซึ่งต่อไปอาจมีการเรียกเก็บจากผู้ขอใช้
2. หน่วยงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ และ/หรือ เรียกเอกสารเพิ่มเติม
3. เพื่อสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ หากพบว่าบุคคล/หน่วยงานภายนอกร่วมมือกับบุคลากร/หน่วยงานภายใน มจธ. เพื่อส่งชิ้นงานสำหรับการทดสอบและวิเคราะห์ในอัตราของ ข้อ ก. หน่วยงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการให้กับบุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานผู้ดูแลจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป